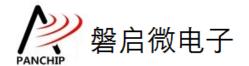


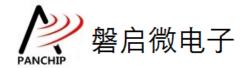
XN297L 硬件设计和调试参考

目录

— 、	原理图设计	. 3
1	.1 原理图	. 3
1	.2 元器件清单	. 3
二、	PCB 设计	. 4
2	.1 板材的选择	. 4
2	.2 电源和地线 LAYOUT	. 4
2	.3 16M 晶振 LAYOUT	. 4
2	.4 控制线 LAYOUT	. 5
2	.5 XN297 芯片封装 LAYOUT	. 5
2	.6 射频匹配电路 LAYOUT	. 6
2	.7 印制板天线 LAYOUT	. 7
2	.8 PCB LAYOUT 示例	. 7
三、	印制板天线设计	. 7
3	.1 印制板天线 layout 设计	. 7
3	.2 Dongle 端的 PIFA 天线设计	. 8
3	.3 遥控器控制板的中尺寸 PIFA 天线设计	. 9
3	.4 无线鼠标板的单极天线设计	11
四、	射频测试	12
4	.1 单载波测试	13
4	.2 接收灵敏度测试	14
4	.3 传输线连接的通信测试	17
4	.4 无线通信测试	18
五、	应用异常分析	18
5	.1 管脚测试情况和芯片工作状态的调试	18
5	.2 单载波调试	20
5	.3 接收本振泄露信号的调试	21



版本	V 1.0
修订	2015. 06



一、原理图设计

1.1 原理图

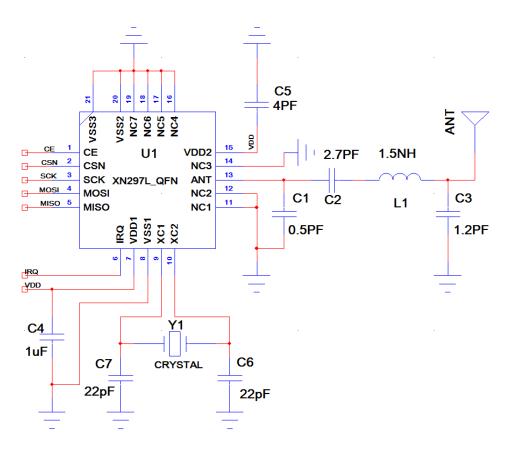


图 1 XN297L 原理图

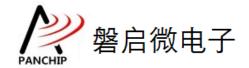
注 1: C6, C7 的元器件值需根据不同的晶振进行调节。

注 2: L1 根据实际效果微调

1.2 元器件清单

表 1 元器件清单

数量	原理图标识	值	封装	描述



1	C1	0.5pF	0402	NPO, ±10%, 50V
1	C2	2.7pF	0402	NPO, ±0.25pF, 50V
1	C3	1.8pF	0402	NPO, $\pm 5\%$, 50V
1	1 C4		0402/0603	NPO, $\pm 5\%$, 50V
1	C5	4pF	0402	NPO, $\pm 5\%$, 50V
2	C6, C7	22pF	0402	NPO, ±5%, 50V
1	L1	1. 5nH	0402	叠层,关键器件,要求误差<±0.3nH,品质因素>8
1	Y1	16MHz	/	要求误差〈±60ppm

二、PCB 设计

2.1 板材的选择

双面 FR4 板材结构。

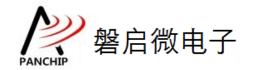
2.2 电源和地线 LAYOUT

电源线基本保证能达到 0.5mm 以上,承受 100 毫安的瞬态电流。在靠近芯片电源管脚放置去耦电容,其中小容量电容靠近芯片以便滤除高频噪声。

如果有条件的话,建议地线采用放射状的连接方式,即 RF 芯片与其它芯片或器件分开来,采用单点接地,并且从总参考地线单独引地线,防止受到干扰。另外,覆地的地线也建议与噪声较少的地线或者总参考地线连接,这样可以有效地减少整个印制板的工作噪声。

2.3 16M 晶振 LAYOUT

- (1) 为保证晶振起振, 16MHz 的晶振至芯片相关管脚的走线不宜超过 5mm;
- (2) 晶振焊盘需要保证外径与内径差值有 0.2mm 以上;
- (3) 为防止晶振信号干扰到射频信号,印制板上在晶振焊盘和走线的两边需要做覆地处理;
- (4) 为避免天线的高输出功率信号干扰到晶振信号,印制板上的天线部分与晶振焊盘走线



部分之间要用 0.5mm 以上地线作为间隔带,同时晶振的外壳需要离天线 3mm 以上。

2.4 控制线 LAYOUT

控制类的 SPI 线、CE 线、IRQ 线需要减少走线干扰,布线时走线较短并且走线两边有完整的覆地。

2.5 XN297 芯片封装 LAYOUT

XN297 为 3mm×3mm 的 QFN 封装的芯片,其芯片底下焊盘需要接地; PCB 做库元件时,在芯片中心需加接地的大 pad,为保证与双层 PCB 的 bottom 层的地平面较好连接,pad 中心至少需要四个过孔 (Via),而且手工焊接时需预先在 pad 加一层薄锡处理。

XN297 芯片下面的 PCB 板的 bottom 层尽量不要有走线和元器件,特别是靠近射频匹配电路的部分,完整的地平面能保证良好的射频性能。下图为芯片封装 layout。

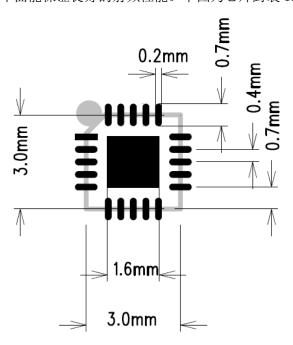


图 2 XN297 芯片封装 LAYOUT (QFN20L0303)

下图为 QFN20L0303 的封装尺寸图。

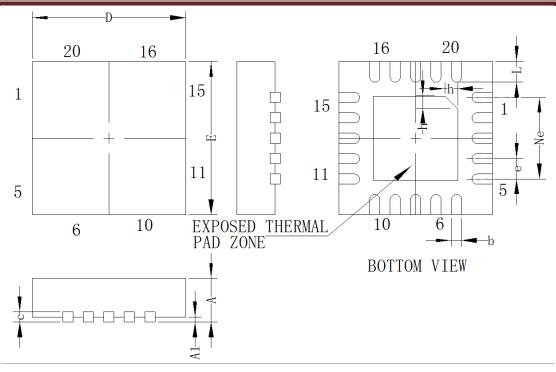


图 3 XN297 芯片封装尺寸图(QFN20L0303)

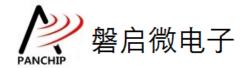
表 2 封装尺寸

SYMBOL	A	A1	b	c	D	e	Nd	Е	L	h
MIM(mm)	0.70		0.15	0.18	2.90			2.90	0.35	0.20
NOM(mm)	0.75	0.02	0.20	0.20	3.00	0.40BSC	1.60BSC	3.00	0.40	0.25
MAXmm)	0.80	0.05	0.25	0.25	3.10			3.10	0.45	0.30

2.6 射频匹配电路 LAYOUT

射频匹配部分电感电容(0402 封装)要严格按照原理图推荐值来设计,由于布局差异可微调电感 L3 的值。射频匹配元器件 layout 原则:

- (1) 为了防止射频前端能量损耗,从管脚 ANT 到天线的走线小于 2mm,并且按照 50 欧姆阻抗走线(线宽 0.5mm,与周边铺地间距 0.3mm,背面完整的参考地),射频匹配部分走线周边的铺地要连贯牢固(多打过孔),可以使得发射能量较多地从天线端出去。
- (2)为了保证阻抗的连续性,射频匹配部分对应的背面参考地要避免放置元器件和走线,需要完整的地平面。
- (3) 覆地建议用实心地。

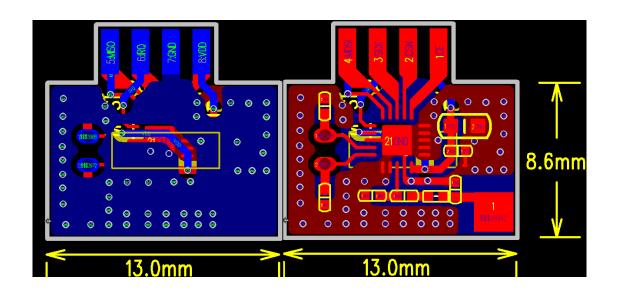


2.7 印制板天线 LAYOUT

推荐使用下一章节的几款印制板天线模型。

天线不能与地线铺铜靠很近,至少3cm。天线部分对应的底层PCB严禁铺地。天线与参考地线铺铜间距要大于1mm。天线周边最好不要有金属结构或元器件、走线,保证在PCB上间隔至少3cm范围内不摆放较大的带金属元器件。

2.8 PCB LAYOUT 示例

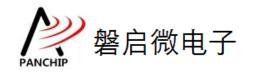


三、印制板天线设计

3.1 印制板天线 layout 设计

2. 4G 的印制板天线主要有两种结构,PIFA 天线和单极天线。PIFA 天线的天线馈电点和地点是接到一起的,天线和地之间形成一个电容效应,就是信号通过天线(等效为电感)升压到等效电容上,通过电容再把能量辐射出去。单极天线是采用 1/4 波长原理,其中一个馈点是螺旋或者单杆,另外一极是地。两种天线的场结构简单,可以简单等效为一个 LC 谐振回路,其中 C 特别小,一个一个的谐振回路耦合上去,最后电磁场释放到外部。

PIFA 天线的电容相对于单极天线来说大很多,也就是说能量在谐振腔中更多,外界不



容易干扰,也很难改变 PIFA 天线的阻抗,所以稳定性比单极天线强;但也因为它的电容太大,导致外界的相同的能量进入,在 PIFA 天线上产生的电压变化,远远不如单极天线大,所以效率和灵敏度低于单极天线。

一般,可以选用外置的鞭状单极天线,外置的鞭状单极天线通信距离较远,不过每套需要单独调试;也可以选用贴片天线芯片,天线芯片占用 PCB 尺寸小,不过价格较高。

实际应用中,考虑到成本和批量生产稳定性等因素,印制板天线因其成本低、设计得当能获得足够性能,成为很多无线应用的首选。本文推荐了三款印制板天线,分别可以应用到Dongle端的小尺寸PIFA天线,应用到无线鼠标板的单极天线和应用到遥控器控制板的中尺寸PIFA天线,这些天线都有对应的仿真和验证结果。如果需要参考对应天线,必须严格按照本文给出的天线形状进行设计。

3.2 Dongle 端的 PIFA 天线设计

Nano Dongle 天线采用超小型的 PIFA 天线,由于 PCB 面积受限,该天线的增益会比其它天线小,对通信距离有影响,一般通信距离可以达到 $15^{\sim}20$ 米左右。由此天线和 XN297 以及 MCU 完成的 Dongle PCB 尺寸为 11.6*16.5mm 左右,PCB 的厚度为 0.6mm。天线具体尺寸如图 4 所示。

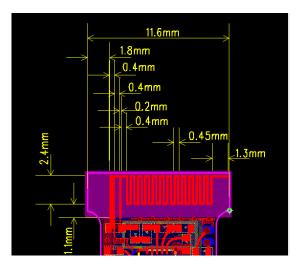


图 4 Nano Dongle 天线设计尺寸参考

天线的 S11 测试数据如图 5 所示,覆盖整个 2.4G 频段。



图 5 Nano Dongle 天线 S11

天线的增益仿真数据如图 6 所示,最大增益为-0.5dB。

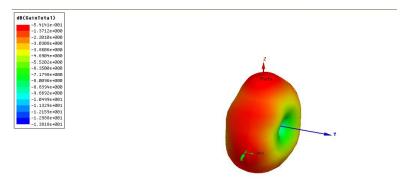


图 6 Nano Dongle 增益和 3D 方向图(X轴为图 4的左右方向,Y轴为图 4的上下方向)

3.3 遥控器控制板的中尺寸 PIFA 天线设计

遥控器控制板的中尺寸 PIFA 天线尺寸如图 7 所示, PCB 的厚度为 1.0mm。

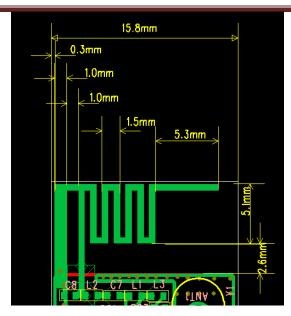
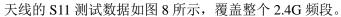


图 7 Module 天线设计尺寸参考



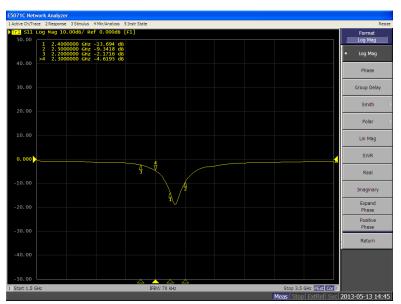


图 8 Module 天线设计 S11

天线的增益仿真数据如图 9 所示,最大增益为 0.9dB。

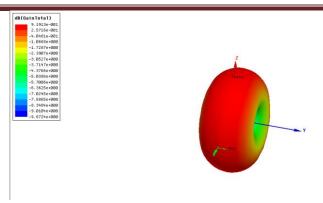


图 9 Module 天线增益和 3D 方向图 (X 轴为图 7 的左右方向, Y 轴为图 7 的上下方向)

3.4 无线鼠标板的单极天线设计

无线鼠标板的单极天线,增益较大,走线灵活,在有足够的 PCB 空间的情况下可以使用。在设计天线位置时,天线放置在无线鼠标板的前部或者左前部,减少右手握住鼠标的情况下手对辐射功率的吸收和衰减,该天线也可以应用到遥控器上;并且根据产品外型可以稍微更改天线的走线形状。参考尺寸如图 10 所示, PCB 的厚度为 1.6mm。

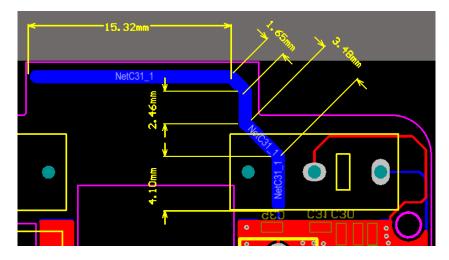


图10 Mouse天线设计尺寸参考

天线的S11测试数据如图11所示,覆盖整个2.4G频段。



图11 Mouse单极子天线S11

天线的增益仿真数据如图12所示,最大增益为3.7dB。

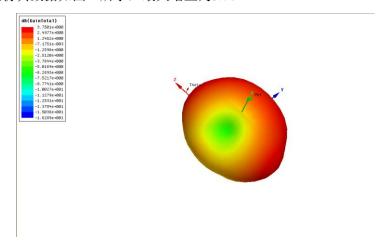


图12 Mouse天线增益和3D方向图(X轴为图10的左右方向,Y轴为图10的上下方向)

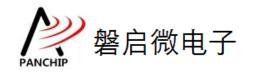
四、射频测试

本章节给出了 XN297L 芯片几个重要参数详细测试方法,包括发射功率、发射频率精度、发射谐波和接收灵敏度测试。

准确评估射频芯片的性能测试通常会使用传导测试方式,需要将芯片与印制板天线断开,在馈点焊接开口缆。

射频测试需要以下的线缆和仪器:

(1) 开口缆,带天线模组要进行射频测试需要在射频馈点地方断开天线,然后在射频馈点 和地线分别焊接开口缆和其外屏蔽罩线;此外,灵敏度测试时解调器的输出通过复用 IRO



和 MISO 两管脚输出 DATA 和 CLK,可以在两管脚处焊接开口揽转接;

- (2) 射频线缆,要求用专门的射频线缆,并且需要测试工作频率内的插入损耗,将该值补偿到测试结果;
- (3) 两根带 SMB 转 SMA 线缆,用于灵敏度测试,将解调器的 DATA 和 CLK 输出接回到 矢量信号发生器的 DATA 和 CLK 输入接口:
- (4) 频谱分析仪,用于测试发射性能,测试 2.4G 载波信号,最高频率要求至少 3GHz;要测试 3次谐波,最高频率至少 7.5GHz;
- (5) 矢量信号发生器,用于测试接收灵敏度,支持的最高频率至少 3GHz,可以测试灵敏度,矢量信号发生器需要带有 BERT 测试模块,推荐仪器例如 E4438C。

4.1 单载波测试

单载波测试组网如图 13 所示。

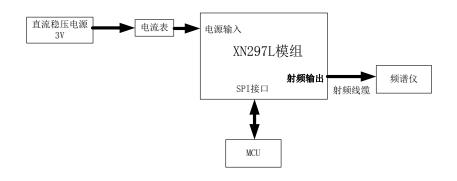


图 13 单载波测试

发射单载波的步骤如下所示:

(1) 配置各 RF 芯片的寄存器进入单载波模式;

uint8_t BB_cal_data[] = $\{0x0A,0x6D,0x67,0x9C,0x46\}$;

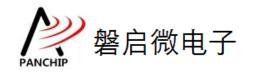
uint8_t RF_cal_data[] = $\{0xF6,0x37,0x5D\}$;

uint8_t RF_cal2_data[] = $\{0x45,0x21,0xEF,0xAC,0x5A,0x50\}$;

uint8 t Dem cal data[] = $\{0xE1\}$;

uint8_t Dem_cal2_data[] = $\{0x0B,0xDF,0x02\}$;

- (2) 设置测试的频道,通信数据率,发射功率;
- (3) 设置频谱仪步骤 1, Central Freq=测试频道, SPAN=10MHz, Ref LEVEL=10dBm,



Attenuation=Auto, RBW=Auto, 测试此时的输出功率和频率,输出功率要加上线缆损耗; 根据读取的频率值,微调晶振处电容可改变频偏。

- (4)设置频谱仪步骤 2, SPAN=Full Span, Ref LEVEL=10dBm, Attenuation=Auto, RBW=Auto; 检波方式 Det/Demod=PEAK; 测试此时各个谐波分量的大小;
- (5) 对于不同厂家的频谱仪,以上频谱仪设置每个功能名称可能会有差别,以上的设置名称是参考 Agilent 仪器给出的。

4.2 接收灵敏度测试

接收灵敏度(Sensitivity)在这颗 RF 芯片的定义是指当接收误比特率(BER: Bit Error Rate)为 0.1%时最小输入信号功率,灵敏度的测试方法有两种,其一为连续伪随机码测试,其二为指定帧格式数据包测试。

连续伪随机码测试:

信号源发送伪随机调制码,芯片配置成灵敏度测试模式,将接收解调器解调后的 DATA 和 CLK 通过复用 IRQ 和 MISO 管脚输出,送回到矢量信号发生器(信号源)E4438C 的 DATA 和 CLK 输入,通过信号发生器内部的 BERT 模块统计误码率 BER,测试组网如图 2 所示。

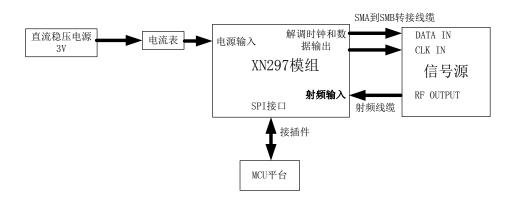
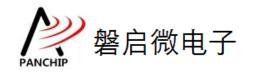


图 14 连续伪随机码的灵敏度测试平台

连续伪随机码的灵敏度测试方法:

- (1) CE LOW;
- (2) 配置各 RF 芯片的寄存器;
- (3) 设置芯片为接收模式, CONFIG 寄存器为 0X0F, CRC 校验打开;
- (4) 设置测试的频道和通信数据率;



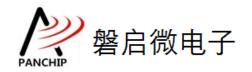
- (5) 设置芯片为连续伪随机码的灵敏度测试模式, REG19_BIT0=1, REG19_BIT7=0, REG19_BIT5=1;
- (6) CE HIGH, CSK HIGH, MOSI HIGH;
- (7) 根据频谱仪测试到的接收 LO 泄漏载波频率,计算要输入矢量信号发生器的射频信号 频率;由于接收频率偏差会影响灵敏度测试,所以 Frf 频率需要根据载波泄漏的频率来做相应调整;
- (8) 接收 LO 泄漏载波频率需要用频谱分析仪测试,测试框图同单载波测试框图一样,在芯片接收模式下,频谱仪设置为,Central Freq=(频道+2)×8÷7,SPAN=10MHz,Ref LEVEL=-50dBm,Attenuation=Auto,RBW=Auto:
- (9) 按上图组网,设置矢量信号发生器 E4438C 如下,Input Frequency 输入射频频率,BEAT DATA 选 PN9,Filter 选 Gauss 且 BT=0.5,Symbol Rate 为 1Mbps 或者 2Mbps,Modulation Type 为 2-Lvl FSK,Freq Dev 选 250KHz(1Mbps)或 500KHz(2Mbps),Input Amplitude 为根据 0.1% BER 测试到的最低值;
- (10) 设置 BERT 为 on,将 BER 测试模块打开,设置 BERT Trigger 为 Immediate;
- (11) 根据 E4438C 统计的 BER 小于 0.1%时,信号源最低输入功率,再减去线缆损耗,得到的值就是接收灵敏度。

指定帧格式数据包测试:

信号源按照指定的帧格式发送数据包,MCU 统计实际接收的帧数,组网下图所示,根据发送的帧数与接收的帧数计算出误帧率 PER,再根据以下公式把 0.1%误码率 BER 换算到对应的误帧率要求,

PER=1 - ((1 - BER) ^ N)

公式中的 N 为每个包的总 bit 数,例如每个包的总 bit 数为 500,那么 0.1%的 BER 对应的 PER 为 39%。



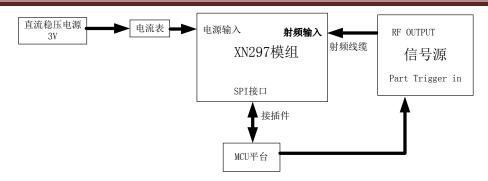
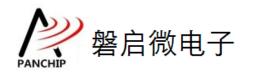


图 15 指定帧格式数据包测试平台

指定帧格式数据包测试步骤

- (1) CE LOW:
- (2) 配置各 RF 芯片的寄存器;
- (3)设置芯片为接收模式, CONFIG 寄存器为 0X0F, CRC 校验打开;
- (4) 设置测试的频道和通信数据率;
- (5) 设置接收地址长度和接收地址;
- (6) 设置 payload 长度;
- (7) CE HIGH, CSK HIGH, MOSI HIGH;
- (8) 根据频谱仪测试到的接收 LO 泄漏载波频率,计算要输入矢量信号发生器的射频信号 频率;由于接收频率偏差会影响灵敏度测试,所以 Frf 频率需要根据载波泄漏的频率来做相 应调整;
- (9) 接收 LO 泄漏载波频率需要用频谱分析仪测试,测试框图同单载波测试框图一样,在芯片接收模式下,频谱仪设置为,Central Freq=(频道+2)×8÷7,SPAN=10MHz,Ref LEVEL=-50dBm,Attenuation=Auto,RBW=Auto;
- (10) 重新按照指定帧格式数据包测试平台组网,设置矢量信号发生器 E4438C 如下,Input Frequency 输入射频频率,BEAT DATA 选择自定义,按照帧格式输入: 前导码(0X710F55)+地址(例如,5 字节 0XCC)+payload(例如此处输入发送 payload 为 32 字节 0X55,实际 payload 是 32 字节 0XAA,发送 payload 与实际 payload 的每字节高低位顺序反方向)+CRC(2字节,DB12算法); BEAT DATA 选 PN9,Filter 选 Gauss 且 BT=0.5,Symbol Rate 为 1Mbps 或者 2Mbps,Modulation Type 为 2-Lvl FSK,Freq Dev 选 250KHz(1Mbps)或 500KHz(2Mbps),Input Amplitude 为根据 0.1% BER 换算到 PER 的值而测试到的最低功率值,Pattern Trigger 为 Single,Trigger Source 为 EXT,触发信号模式为上升沿触发,通过 MCU 的 IO 引脚给出



该上升沿控制发送帧数,要求发送的帧数必须大于 200 帧,根据接收帧数情况,得到最低输入功率,减去线缆损耗,得到的值就是指定帧格式数据包接收灵敏度;

- (11) 接收端的 RX_FIFO 正确接收一帧数据,接收数据中断 "RX_DR"都会被置 0,这时需要读 FIFO 或清 FIFO,清中断,写接收数据中断 "RX_DR"为 1,重新等待接收下一帧的数据:
- (12) 判断接收成功可以通过,硬件查询 IRQ 管脚是否为低电平或者定期查询状态寄存器的 RX_DR 位是否为 1。

4.3 传输线连接的通信测试

让一端做发射,另一端做接收,信号传输线连接通过衰减器,通过控制衰减器的衰减分 贝数大小来控制丢包率。当丢包率达到等效误码率的计算值时,记录此时的衰减量,补偿连 接线插入损耗值后可以计算信号的衰减值,由该值可以计算出等效通信距离。传输线连接的 测试平台见图 16 所示。

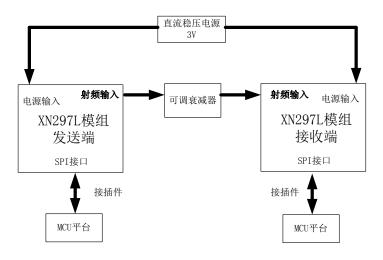
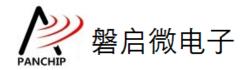


图 16 传输线连接的测试平台

传输线连接的测试步骤:

- (1)接收端配置为接收模式,发送端配置成发送模式,必须保证通信频道、地址、数据率、数据长度、CRC设置、不带 ACK 和不带自动重传方式等的设置收发一致;
- (2) 每收到并读取一帧数据,需要清除接收 RX_DS 中断并清空接收 FIFO;每发送一帧之前需要清空发送 FIFO 并且写入 payload,发出一帧之后需要清除 TX DR 中断;



- (3) 重复以上步骤, 直到完成指定帧数的发送, 接收端的 MCU 将收到的有效帧数上报:
- (4) 统计接收端收到正确的帧数,去调整可调衰减器的衰减量,在接收到正确的帧数等效于 0.1% BER 时,记录此时的衰减量。

4.4 无线通信测试

基本等同于 4.3 节的测试方法, 仅将传输线去除, 改为收发两边都用天线方式, 测试通信距离代替传输线连接时的衰减器测试。

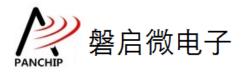
五、应用异常分析

5.1 管脚测试情况和芯片工作状态的调试

如果 RF 芯片不能正常工作,首先要排除硬件问题,如焊接是否完整,外围元器件是否正确完备。可以根据 RF 芯片的几个管脚测试情况并结合芯片工作状态,来做初步判断。

表 3 芯片管脚在各工作状态的情况

芯片管脚 工作状态	ANT	XC1	XC2
休眠模式	OV	OV	OV
		16MHz 正弦波	16MHz 正弦波
待机模式−I	OV	直流 0.7V	直流 0.7V
		VPP=0.6V	VPP=0.6V
		16MHz 正弦波	16MHz 正弦波
待机模式-II	1.8V	直流 0.7V	直流 0.7V
		VPP=0.6V	VPP=0.6V
待机模式-III	OV	16MHz 正弦波	16MHz 正弦波
1寸7017天八-111	ΟV	直流 0.7V	直流 0.7V



		VPP=0.6V	VPP=0.6V
		16MHz 正弦波	16MHz 正弦波
接收模式	1.8V	直流 0.7V	直流 0.7V
		VPP=0.6V	VPP=0.6V
		16MHz 正弦波	16MHz 正弦波
发射模式	1.8V	直流 0.7V	直流 0.7V
		VPP=0.6V	VPP=0.6V

可按照以下步骤快速判断硬件问题:

- (1) 通过目测来检查焊接无短路和虚焊。判断短接的方法:用万用表欧姆档测量相邻的管脚是否阻抗小于 100ohm;判断虚焊的方法:用万用表二极管档测量各个管脚对地的二极管特性,地接正极,管脚接负极,正常的值应该在 0.3~0.8,如果虚焊或者 ESD 打坏,显示 OPEN 或超过 1 的值。
- (2) 示波器查看晶振是正常工作,如果晶振不起振时,可以适当减小与晶振连接的并联到地的电容容值。16MHz 晶振需要选用 Q 值较高的、驱动功率较低的、需要的并联到地的电容较小的、批量一致性好的、温度变化率低的,Q 值较高、驱动功率较低、需要的并联到地的电容较小的晶振,可以使得芯片内部驱动晶振的电流较小,从而更易起振并且晶振谐波信号较低。每一次更换晶振后,与晶振连接的并联到地的电容容值需要微调一下,保证频率准确。Q = f0/(f2-f1),由此可见同样频率的晶振,品质因素高、并联电容小的晶振需要的驱动功率较低。

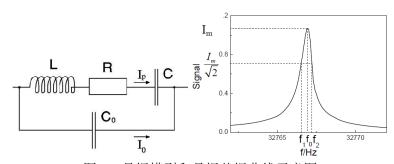
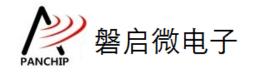


图 17 晶振模型和晶振共振曲线示意图

- (3) 测试 ANT 是否为 1.8V。在 ANT 测到不为 1.8V, 查看匹配电路部分是否焊接正确。
- (4) 查看软件的配置是否正确。



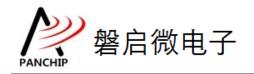
5.2 单载波调试

单载波发射是 RF 芯片的一种能够集中反映硬件是否已完备的测试模式,以下是准备进入单载波调试的步骤:

- (1)检查芯片的 SPI 命令读写是否正常;写入各寄存器中能 R/W 的寄存器,然后再读出来,如果写入和读出一致,说明 SPI 读写正常;
- (2) 如果 SPI 读写不正常,需要用示波器或逻辑分析仪查看读写寄存器的波形,检查 SPI 四根线的电平转换是否正常,发送命令或者数据的波形是否与代码设想的波形一样;
- (3) 部分 MCU 是采用普通 I/O 口的软件模拟 SPI 方式,需要检查 SPI 四线的采样和保持时间是否符合 SPI 规范, MCU 支持单步调试的可以配合 SPI 波形单步跟踪查验代码:
- (4) 检查 MCU 初始化配置,尤其是引脚的输入输出定义; 检查软件实现是否正常:
- (5)检查 MCU 软件实现是否正常,与提供的参考代码对比,尤其要关注各寄存器设置是 否有差异:

以下是进入发送单载波后的调试步骤:

- (1) 用频谱仪检测频谱上在 2.4G 频段是否有大的功率信号出现。如果没有,说明发射通道不通,需要检测焊接和软件等方面的问题;如果在 2.4G 频段看到有大功率的信号,说明发射通道基本 ready;
- (2) 检查单载波频谱是否正常锁定,按频谱仪的 PEAK Search 键,并将单载波峰值频率移到频谱仪的中心频率,设置频谱仪的 SPAN 为 1MHz;如果检测到的频率与软件写入的频道基本一致(差异±500KHz 以内),而且频谱就是单一的一根,不会来回抖动或者是很宽乱跳的频谱,说明单载波正常锁定。如果单载波不能锁定,出现手摸天线恢复正常等现象,微调前端匹配值可恢复正常;
- (3) 单载波锁定频率精度测试,频谱仪 SPAN 设置为 1MHz,读取此时的载波频率,计算实测频率与理论频率(2400+N)偏差,要求中心频率偏差小于 100KHz,对于 60ppm 的晶体,批量下的最大频率偏差为 2400MHz×60ppm=150KHz。如果是个别调试板出现频率偏差较大,建议更换晶振;如果是大部分量产板都出现中心频率偏差较大,建议更改与晶振连接的两个外围电容的容值,单载波频率偏高时增大电容值,单载波频率偏低时减小电容值;如果以上两种方法操作没有效果,可能需要更换晶振;
- (4) 可以测试单载波相位噪声(频谱仪需要有测试相位噪声的功能模块),在偏移中心频率 1KHz、10KHz、100KHz 和 1MHz 地方分别要求测试相位噪声低于-60dBc/Hz、-70dBc/Hz、-80dBc/Hz 和-100dBc/Hz,如果测试结果比以上数据差较多,需要定位晶振相关的管脚和外



围电路是否问题,必要时需要更换另一种晶振;

- (5) 单载波杂散测试,将频谱仪 SPAN 设置为 2MHz,观测单载波的两边的 SPUR 是否都小于 20dBc,小于 20dBc 为正常;异常时需要检查芯片的电源线和地线是否存在纹波或者毛刺杂波;
- (6) 电源线/地线检查,示波器设置成 AC Coupled,参考地线连在待测 PCB 板的总输入地线处,如果电源线或者地线的噪声峰峰值小于 20mv,说明电源线/地线正常;反之异常,需要找到干扰源,一般可以通过稳压源外灌电源或增加滤波电容等方法来分析;
- (7) 检查射频匹配电路和天线是否正常,目测射频匹配电路和天线部分是否与提供的参考电路完全相同,包括元器件值、PCB 版图和走线长度、周围覆地和天线尺寸。测试天线贴近情况下的无线辐射功率或者开口缆连 SMA 转接头的传导输出功率,如果天线辐射功率小于设定值 15dB 以上或者传导输出功率小于设定值 3dB 以上,需要重新匹配;必要时请依靠网络矢量分析仪测试天线特性。

5.3 接收本振泄露信号的调试

接收端需要检验接收本振泄漏信号是否正常。

- (1)接收本振泄漏信号是芯片内部载波信号耦合至芯片外的,从天线处用 SMA 转接头连接测试到泄漏信号在-50~-60dBm,对通信性能没有影响,可以通过接收本振判断接收通道是否工作正常,接收本振的频率计算按照以下公式为, F_{lo} =(频道+2)×8÷7
- (2)接收本振频率范围为 2747~2840MHz,设置频谱仪的 central Freq=2800MHz, SPAN=600MHz, Atten=0dB, Ref Amplitude=-50dBm,观测频谱仪是否有信号,如果有信号而且频率与上面计算的频率较接近,幅度值差不多,说明接收通道是正常的;同时 PEAK Search 到本振泄露频率,设置为中心频率,SPAN=1MHz,观测到信号频谱是单一且稳定的一根单频载波,说明接收本振锁定;反之接收本振没有锁定;
- (3)接收本振锁定频率精度测试,PEAK Search 到本振泄露频率,设置为中心频率,SPAN=1MHz,测试本振泄漏的频率,按照晶体 60ppm 的要求,本振泄漏载波的中心频率偏差不能超过 170KHz。